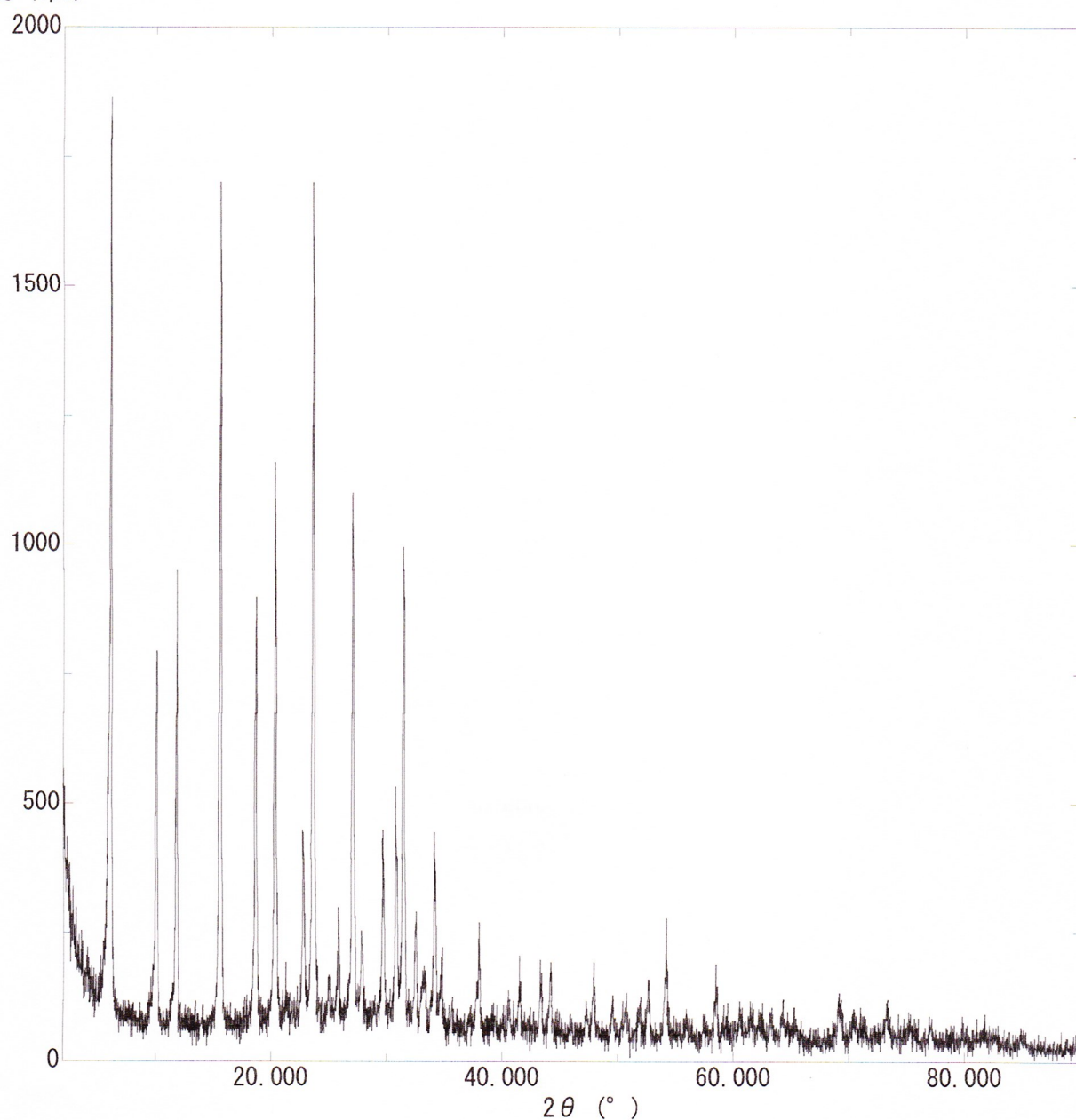


生データ

サンプル名	: H型Yセオライト	ファイル	:
コメント	: 学生実験 消さない	測定日	: 14-April-15 13:16:40
測定者	: Administrator		
メモ	:		
X線	: Cu / 40 kV / 20 mA		
ゴニオメータ	: Ultima+ 水平ゴニオメータ		
アタッチメント	: 標準試料ホルダー		
試料番号	: 1		
フィルタ	: 不使用	発散スリット	: 1°
インシデントモノクロ	: 不使用	散乱スリット	: 1°
カウンタモノクロメータ	: 全自動モノクロメータ	受光スリット	: 0.15mm
カウンタ	: シンチレーションカウンタ (SC50)	モノクロ受光スリット	: 0.8mm
走査モード	: 連続	スキャンスピード	: 5.000 ° /min.
サンプル幅	: 0.020 °	走査軸	: 2θ / θ
走査範囲	: 2.000 ~ 90.000 °	θオフセット	: 0.000 °
積算回数	: 1		

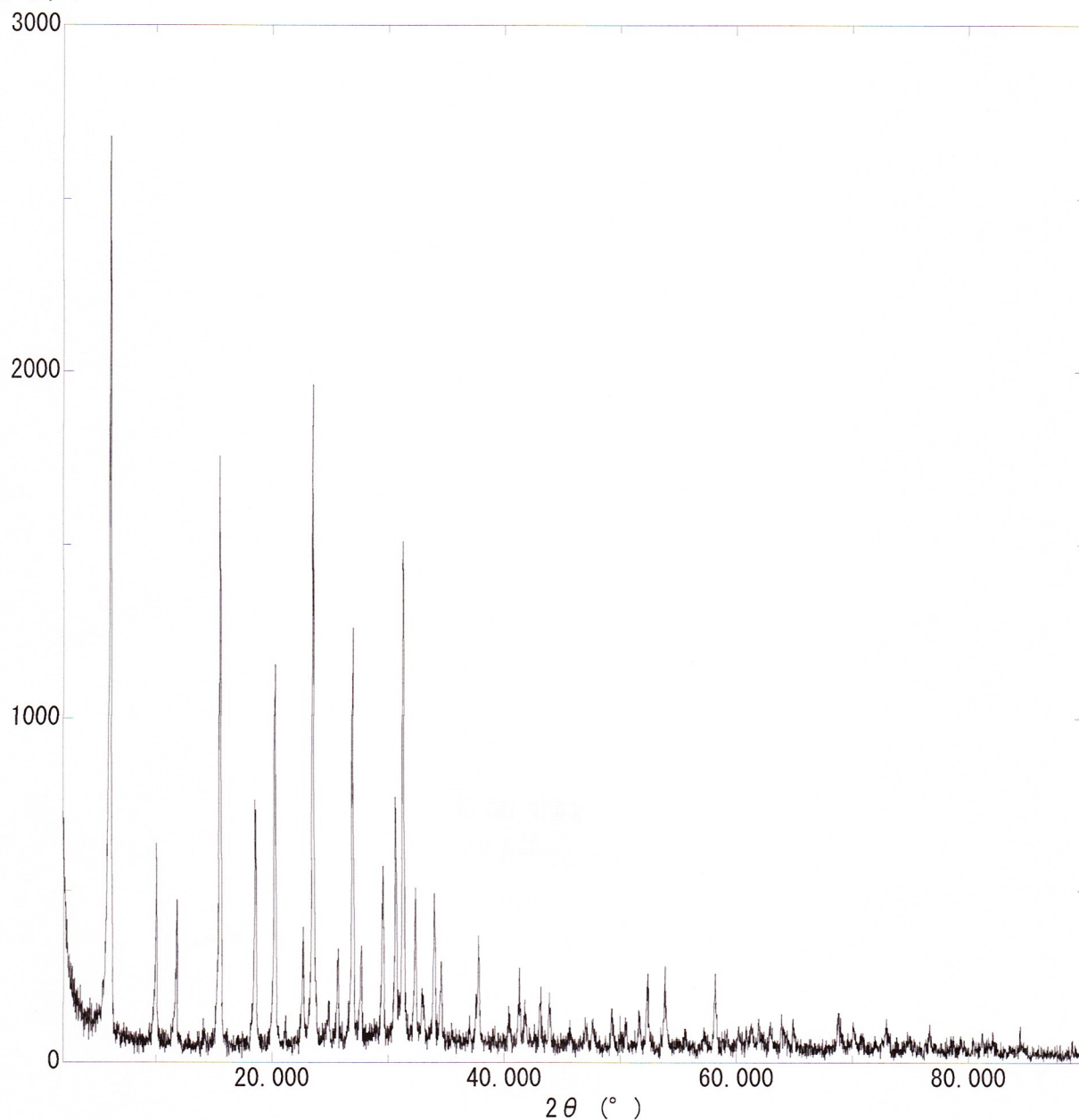
強度 (cps)



生データ

サンプル名	: Na型ゼオライト	ファイル	:
コメント	: 学生実験 消さない	測定日	: 14-April-15 16:30:47
測定者	: Administrator		
メモ	:		
X線	: Cu / 40 kV / 20 mA		
ゴニオメータ	: Ultima+ 水平ゴニオメータ		
アタッチメント	: 標準試料ホルダー		
試料番号	: 1		
フィルタ	: 不使用	発散スリット	: 1°
インシデントモノクロ	: 不使用	散乱スリット	: 1°
カウンタモノクロメータ	: 全自動モノクロメータ	受光スリット	: 0.15mm
カウンタ	: シンチレーションカウンタ (SC50)	モノクロ受光スリット	: 0.8mm
走査モード	: 連続	スキャンスピード	: 5.000 ° /min.
サンプルリング幅	: 0.020 °	走査軸	: 2θ / θ
走査範囲	: 2.000 ~ 90.000 °	θ オフセット	: 0.000 °
積算回数	: 1		

強度 (cps)

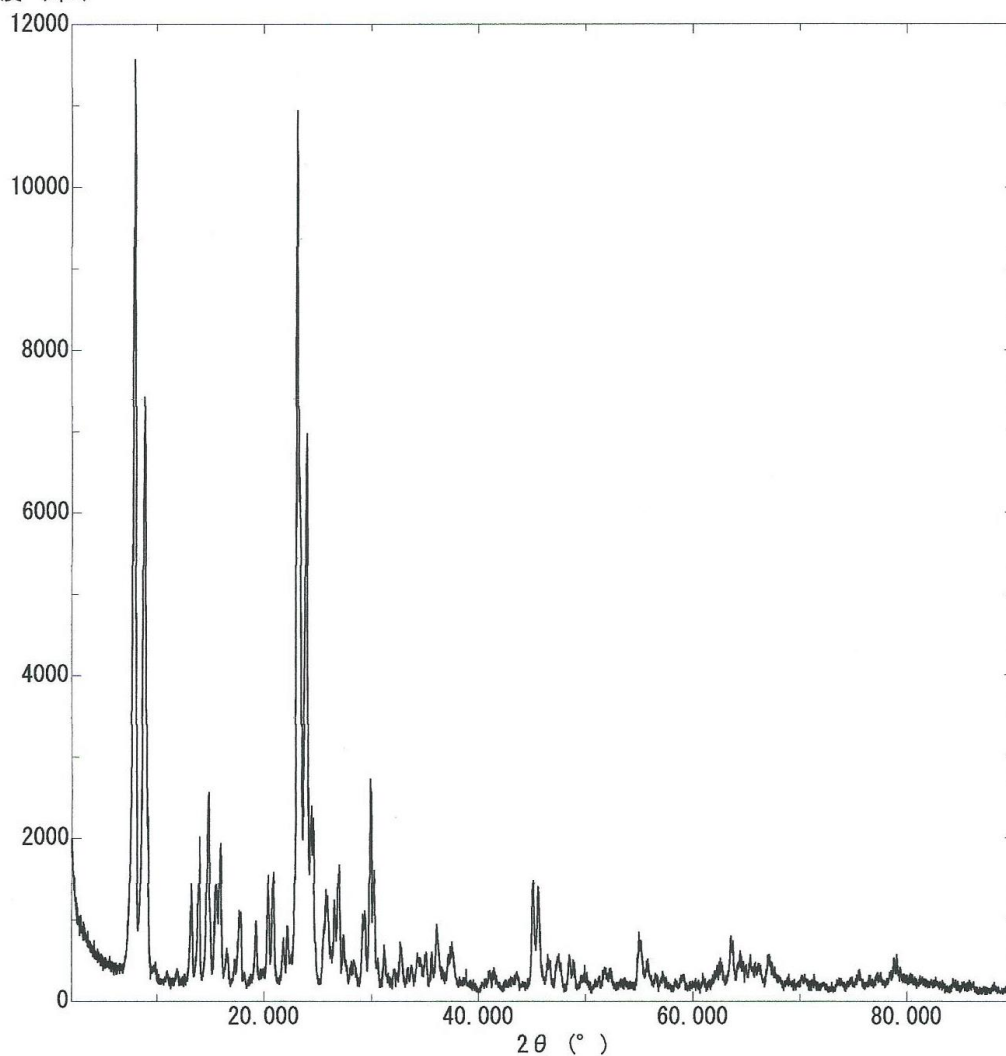


生データ

サンプル名	: ZSM5	ファイル	: ZSM5.raw
コメント	: CX-8学実	測定日	: 09-April-13 15:33:37
測定者	: Administrator		
メモ	:		

X線	: Cu / 40 kV / 40 mA	発散スリット	: 1°
ゴニオメータ	: Ultima+ 水平ゴニオメータ	散乱スリット	: 1°
アタッチメント	: 標準試料ホルダー	受光スリット	: 0.3mm
試料番号	: 1	モノクロ受光スリット	: なし
フィルタ	: 不使用		
インシデントモノクロ	: 不使用		
カウンタモノクロメータ	: 全自動モノクロメータ		
カウンタ	: シンチレーションカウンタ (SC50)		
走査モード	: 連続	スキャンスピード	: 5.000 ° /min.
サンプルリク幅	: 0.020 °	走査軸	: 2θ / θ
走査範囲	: 2.000 ~ 90.000 °	θ オフセット	: 1.000 °
積算回数	: 1		

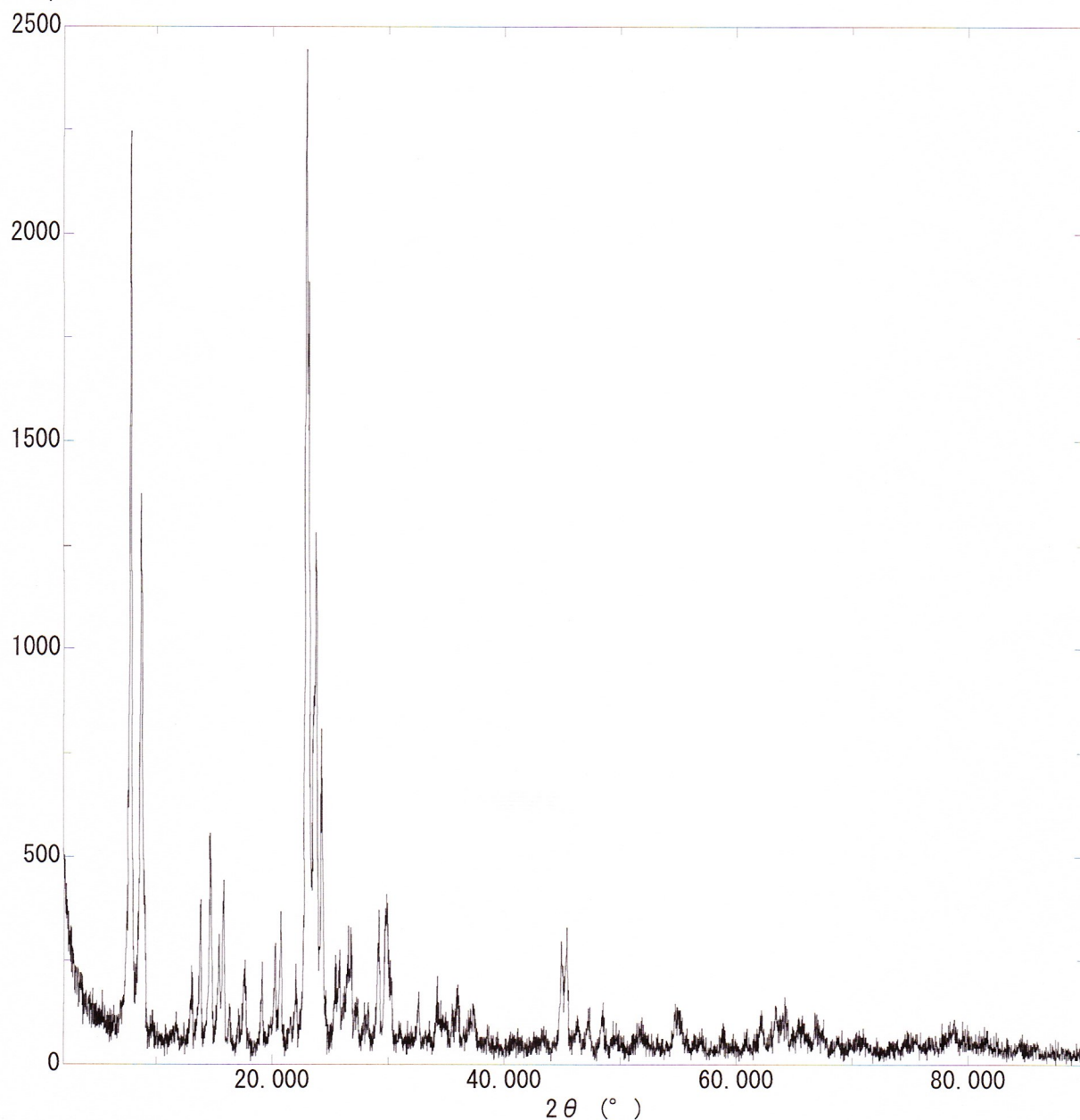
強度 (cps)



生データ

サンプル名	: NH ₄ /ZSM-5	ファイル	:
コメント	: 学生実験 消さない	測定日	: 14-April-15 15:02:40
測定者	: Administrator		
メモ	:		
X線	: Cu / 40 kV / 20 mA		
ゴニオメータ	: Ultima+ 水平ゴニオメータ		
アタッチメント	: 標準試料ホルダー		
試料番号	: 1		
フィルタ	: 不使用	発散スリット	: 1°
インシデントモノクロ	: 不使用	散乱スリット	: 1°
カウンタモノクロメータ	: 全自動モノクロメータ	受光スリット	: 0.15mm
カウンタ	: シンチレーションカウンタ (SC50)	モノクロ受光スリット	: 0.8mm
走査モード	: 連続	スキャンスピード	: 5.000 ° /min.
サンプルリング幅	: 0.020 °	走査軸	: 2θ / θ
走査範囲	: 2.000 ~ 90.000 °	θ オフセット	: 0.000 °
積算回数	: 1		

強度 (cps)



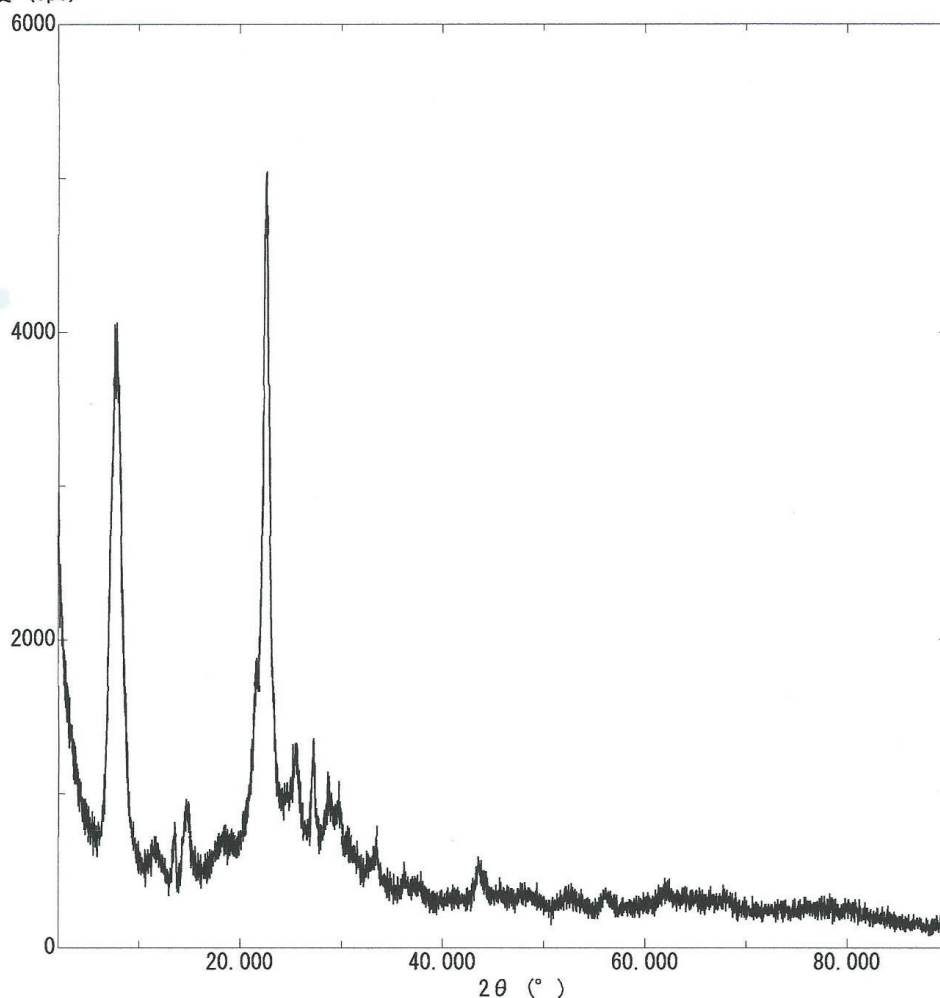
生データ

サンプル名	: β ゼオライト	ファイル	: β ゼオライト.raw
コメント	: CX-8学実	測定日	: 09-April-13 16:12:01
測定者	: Administrator		
メモ	:		

X線	: Cu / 40 kV / 40 mA	発散スリット	: 1°
ゴニオメータ	: Ultima+ 水平ゴニオメータ	散乱スリット	: 1°
アタッチメント	: 標準試料ホルダー	受光スリット	: 0.3mm
試料番号	: 1	モノクロ受光スリット	: なし
フィルタ	: 不使用		
インシデントモノクロ	: 不使用		
カウンタモノクロメータ	: 全自動モノクロメータ		
カウンタ	: シンチレーションカウンタ (SC50)		

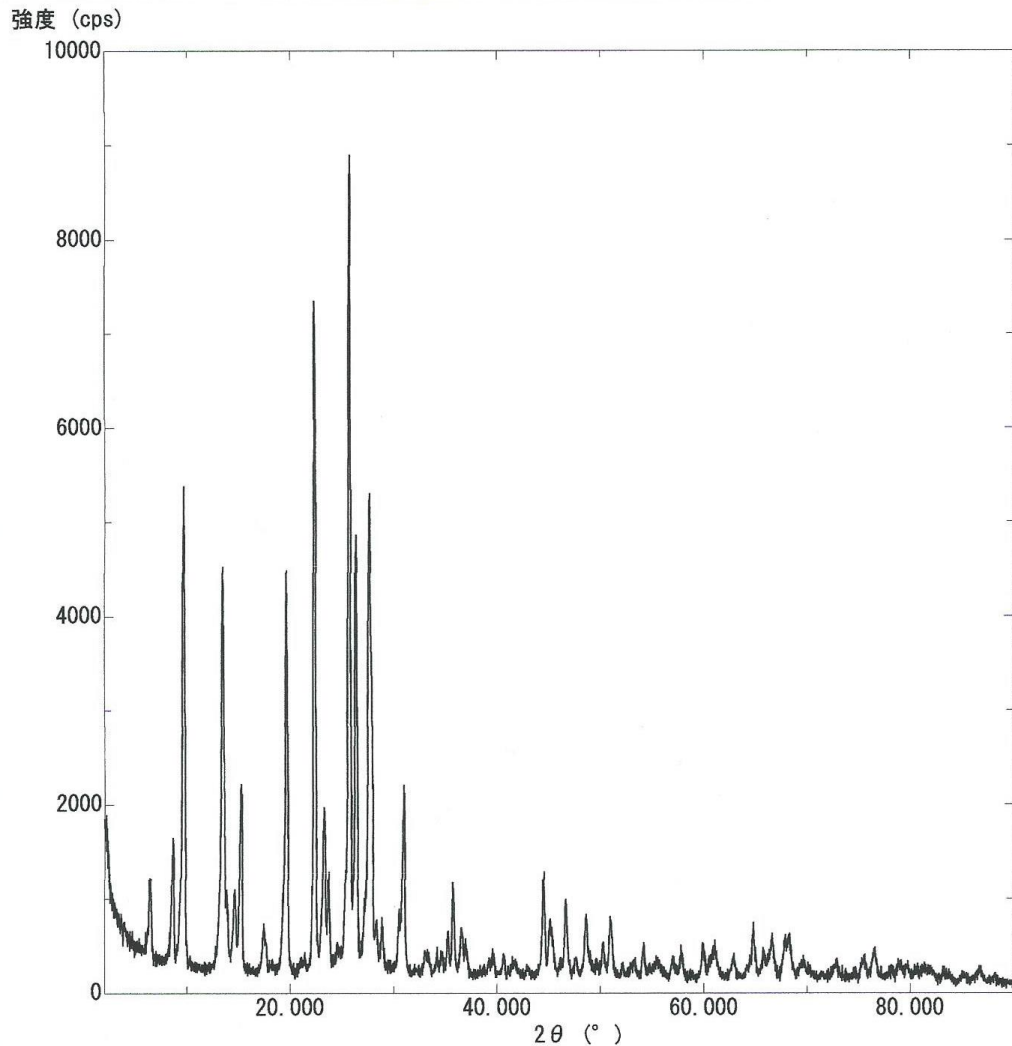
走査モード	: 連続	スキャンスピード	: 5.000 ° /min.
サンプルリク幅	: 0.020 °	走査軸	: 2 θ / θ
走査範囲	: 2.000 ~ 90.000 °	θ オフセット	: 1.000 °
積算回数	: 1		

強度 (cps)



生データ

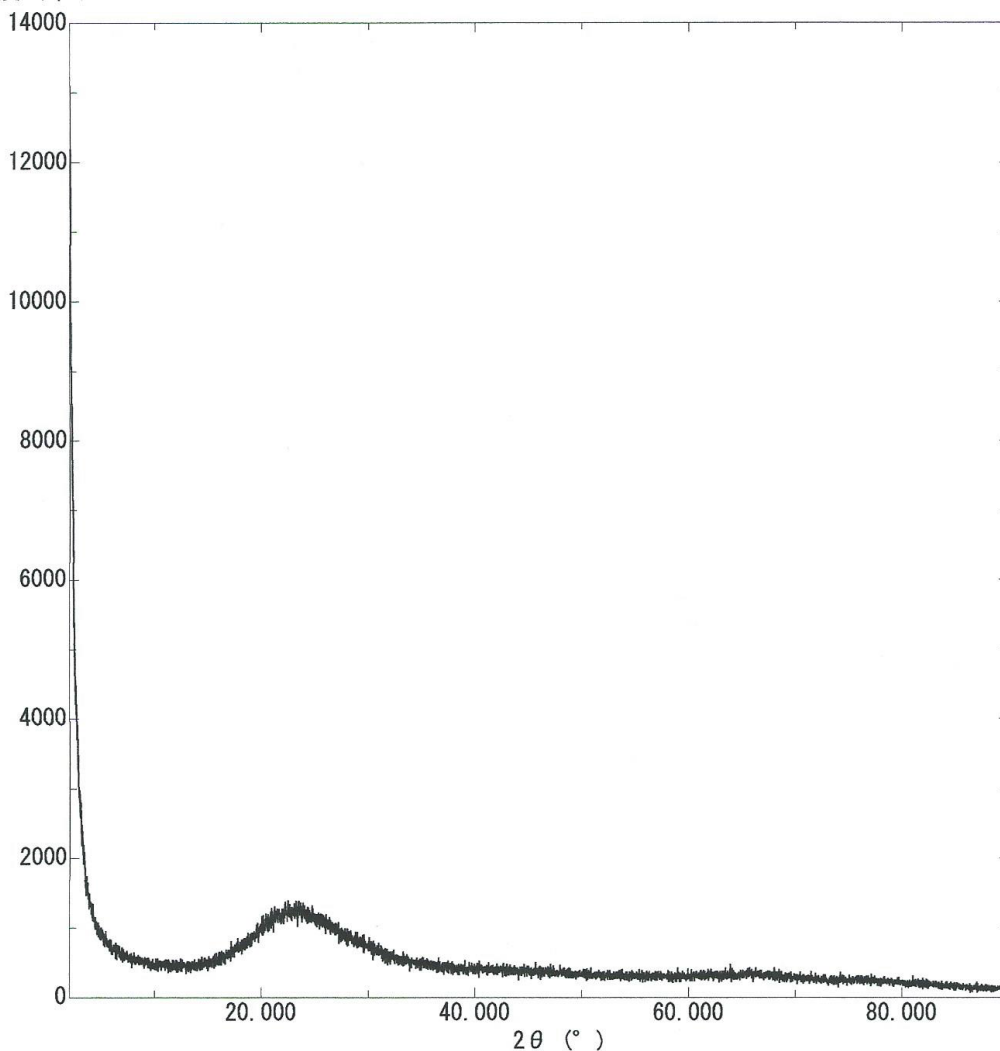
サンプル名	: モルデナイト	ファイル	: モルデナイト.raw
コメント	: CX-8学実	測定日	: 09-April-13 16:51:07
測定者	: Administrator		
メモ	:		
X線	: Cu / 40 kV / 40 mA		
ゴニオメータ	: Ultima+ 水平ゴニオメータ		
アタッチメント	: 標準試料ホルダー		
試料番号	: 1		
フィルタ	: 不使用	発散スリット	: 1°
インシデントモノクロ	: 不使用	散乱スリット	: 1°
カウンタモノクロメータ	: 全自動モノクロメータ	受光スリット	: 0.3mm
カウンタ	: シンチレーションカウンタ (SC50)	モノクロ受光スリット	: なし
走査モード	: 連続	スキャンスピード	: 5.000 ° /min.
サンプル幅	: 0.020 °	走査軸	: 2θ / θ
走査範囲	: 2.000 ~ 90.000 °	θオフセット	: 1.000 °
積算回数	: 1		



生データ

サンプル名	: シリカアルミナ	ファイル	: Si-Al.raw
コメント	: CX-8学実	測定日	: 09-April-13 15:13:59
測定者	: Administrator		
メモ	:		
X線	: Cu / 40 kV / 40 mA		
ゴニオメータ	: Ultima+ 水平ゴニオメータ		
アタッチメント	: 標準試料ホルダー		
試料番号	: 1		
フィルタ	: 不使用	発散スリット	: 1°
インデントモノクロ	: 不使用	散乱スリット	: 1°
カウンタモノクロメータ	: 全自動モノクロメータ	受光スリット	: 0.3mm
カウンタ	: シンチレーションカウンタ (SC50)	モノクロ受光スリット	: なし
走査モード	: 連続	スキャンスピード	: 5.000 ° /min.
サンプルリグ幅	: 0.020 °	走査軸	: $2\theta / \theta$
走査範囲	: 2.000 ~ 90.000 °	θ オフセット	: 1.000 °
積算回数	: 1		

強度 (cps)



生データ

サンプル名	: 活性アルミナ	ファイル	: 活性アルミナ.raw
コメント	: CX-8学実	測定日	: 09-April-13 15:53:01
測定者	: Administrator		
メモ	:		
X線	: Cu / 40 kV / 40 mA		
ゴニオメータ	: Ultima+ 水平ゴニオメータ		
アタッチメント	: 標準試料ホルダー		
試料番号	: 1		
フィルタ	: 不使用	発散スリット	: 1°
インシデントモノクロ	: 不使用	散乱スリット	: 1°
カウンタモノクロメータ	: 全自動モノクロメータ	受光スリット	: 0.3mm
カウンタ	: シンチレーションカウンタ (SC50)	モノクロ受光スリット	: なし
走査モード	: 連続	スキャンスピード	: 5.000 ° /min.
サンプルリニア幅	: 0.020 °	走査軸	: 2θ / θ
走査範囲	: 2.000 ~ 90.000 °	θ オフセット	: 1.000 °
積算回数	: 1		

